

ZP/UR/78/2012

Rzeszów dnia 01.08.2012r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 01.08.2012r.

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
al. Rejtana 16c
35-959 Rzeszów
NIP 813-32-38-822
REGON 691560040

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące postępowania na:

Dostawę fabrycznie nowej aparatury laboratoryjnej do badania zmiennotemperaturowych charakterystyk magnetotransportowych półprzewodnikowych próbek w zakresie wartości temperatury 0,3K-300K oraz pola magnetycznego do 12 T.

Pytanie 1 :

Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający wymaga dostarczenia:

I Insert

Insert służący do ładowania od góry próbki (Top Loading) do pomiarów zmiennotemperaturowych z wkładem 3H (sample in 3He liquid/gass), kontrolerem temperatury oraz układem pompującym: w zakresie temperatur 0,3K oraz co najmniej 300K, temperatura regulowana w sposób ciągły od najniższej do najwyższej ze stabilnością nie gorszą niż ± 0.01 K w ciągu 10 min i dokładnością pomiaru temperatury nie gorszą niż 0.01K dla temperatur $T \leq 20$ K oraz nie gorszą niż 0.05 K dla temperatur wyższych niż 20K, przestrzeń próbki o średnicy ≥ 20 mm. System zaopatrzonej w potrzebną ilość 3H do prawidłowego działania w szczególności do osiągnięcia temperatury minimalnej nie wyższej niż 0,3K.

Nawiązując do powyższego punktu zwracamy się z pytaniem:

Czy Zamawiający dopuści umieszczenie próbki w próżni, przy założeniu, że takie rozwiązanie zapewni osiągnięcie pozostałych wymagań dotyczących zakresu, regulacji, stabilności i dokładności pomiaru temperatur, opisanych w tym punkcie?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie konstrukcyjne kriostatu (insertu oraz uchwytu), które daje możliwość umieszczenia próbki (próbek) w próżni pod warunkiem osiągnięcia wymienionych parametrów w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności:

1. Możliwość pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych w polu magnetycznym do 12 T w zakresie temperatur 0,3-300K z dokładnością pomiaru temperatury nie gorszą niż 0.01K dla temperatur $T \leq 20$ K oraz nie gorszą niż 0.05 K dla temperatur wyższych niż 20K ze stabilnością jej pomiaru nie gorszą niż ± 0.01 K w ciągu 10 min.
2. Czas przygotowania systemu do gotowości pomiarowej od momentu umieszczenia uchwyty z próbką (próbkami) w schłodzonym kriostacie do osiągnięcia minimalnej temperatury (0,3K) nie był dłuższy niż 200 minut.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SIWZ.

.....
*Sekretarz komisji
przetargowej*

Z up. Rektora UR
KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych
mgr inż. Eugeniusz Niżnik
.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*